

【붙임 2】

규격서(구매, 제조·제작 요청용)

□ 구매개요

품명	(한글)*:Collection optics 및 Thomson signal stabilizing 장치의 진단, 제작 구매 (영문) :		
< 연구장비 또는 연구시설 관련 구매 시 추가 작성 >			
구매 종류	<input type="checkbox"/> 연구장비 <input type="checkbox"/> 연구부속장비 <input type="checkbox"/> 연구장비성능향상 <input type="checkbox"/> 연구장비수리 <input type="checkbox"/> 기타 <input checked="" type="checkbox"/> 연구시설구축 <input type="checkbox"/> 시설부속장비 <input type="checkbox"/> 시설성능향상 <input type="checkbox"/> 시설수리		
과제계획 반영여부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영 <input type="checkbox"/> 미반영	공동활용 여부*	<input type="checkbox"/> 타부서와 공동활용 가능 <input type="checkbox"/> 타기관과 공동활용 가능 <input checked="" type="checkbox"/> 공동활용 불가능
중복 구매여부	<input type="checkbox"/> 중복 <input checked="" type="checkbox"/> 미중복		
제조사 (제조국가)		추정가격* (부가세 포함)	196,760,000원 (부가세 포함)

※ * 표시 필수 입력사항

※ 3천만원 이상 또는 타기관 공동활용가능 연구장비 등 구매 완료 30일 이내 nfec-input.ntis.go.kr 등록 필수

□ 규격 및 사양(기기 구성품 또는 구매물품 내역 등)

<ul style="list-style-type: none"> ● 개요 <ul style="list-style-type: none"> • 본 구매는 국가핵융합연구소에서 운영 중인 차세대 초전도 핵융합 연구장치(KSTAR)의 물리연구를 위하여 반드시 필요한 파라미터인 전자밀도와 전자 온도분포를 측정하는 KSTAR 톰슨산란장치의 signal stabilizing 장치 및 collection optics 장치를 진단, 설계, 제작 및 설치하는데 목적이 있다. ● 구성 <ol style="list-style-type: none"> (1) 톰슨 collection lens (코어, 옛지) (2) 톰슨 collection lens 하우징 (코어, 옛지) <ul style="list-style-type: none"> - collection lens 조정 및 고정을 위한 광학 마운트/스테이지 포함 - 광화이버 클램프 및 클램프 조정용 로드 포함 (3) 렌즈 진동방지 지지대 기구물 <ul style="list-style-type: none"> - KSTAR의 Nm port로부터 주장치 하부까지 렌즈의 진동방지를 위한 지지대가 주장치 상부 및 하부에 설치되는 구조 - 렌즈를 Nm port 카세트 내부에 효과적으로 넣을 수 있는 기구물 (4) 포트 접근용 덱 구조 변경 <ul style="list-style-type: none"> - 기존에 설치되어 있는 포트 접근용 덱 구조물이 지지대 기구물 및 주변 기타 장치와 간섭을 일으키지 않도록 구조 변경 (5) Optics 시험 기구 <ul style="list-style-type: none"> - 렌즈 설치 시 진공용기 안을 진행하는 레이저빔의 3차원 프로파일 측정을 위한 장비
--

및 설치용 기구물 일체

※ 조달청 지정정보처리장치(전자견적시스템) 사용에 따른 명확한 규격 및 사양이 요구됨으로 견적서와 필요 시 사진, 카달로그, 시방서, 도면 등 첨부 요망

□ 구매사유 및 활용용도

- KSTAR 톨슨산란장치의 진동을 억제하여 신호 측정 안정성을 높일 수 있는 signal stabilizing 장치 제작 및 설치
- KSTAR 톨슨산란장치의 수광 효율을 향상시켜 SNR을 높일 수 있는 collection optics 장치의 진단 및 제작, 설치
- KSTAR의 물리연구를 위하여 반드시 필요한 파라미터인 전자밀도와 전자 온도분포의 측정 정밀도 향상 및 이를 이용한 고수준 물리 연구 수행